

FE-SEMおよび各種分析法を用いた金属組織の観察および分析

利用事例: 金属材料のマイクロ組織を詳細に観察・分析したい。



富山県ものづくり研究開発センターの電界放出形走査型顕微鏡 (FE-SEM) は細く絞った電子線を試料表面に照射・走査し、発生する信号を検出して、表面観察および分析を行う装置です。

サーマルショットキー電界放出形電子銃を使用しており、幅広い材料のナノオーダーでの表面観察することが可能です。大照射電流により分析にも適しており、元素組成分析や結晶方位解析が可能です。



実施例

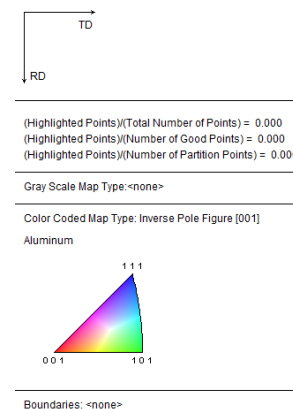
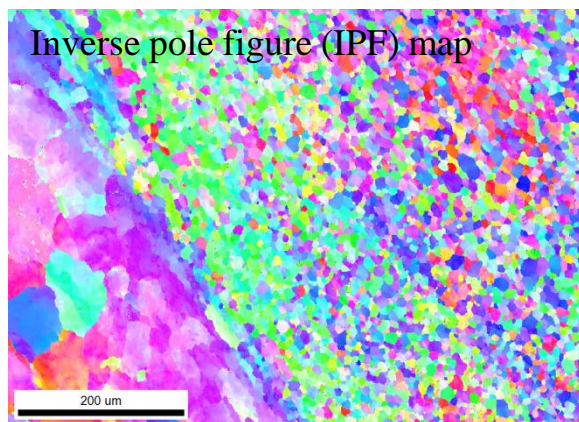
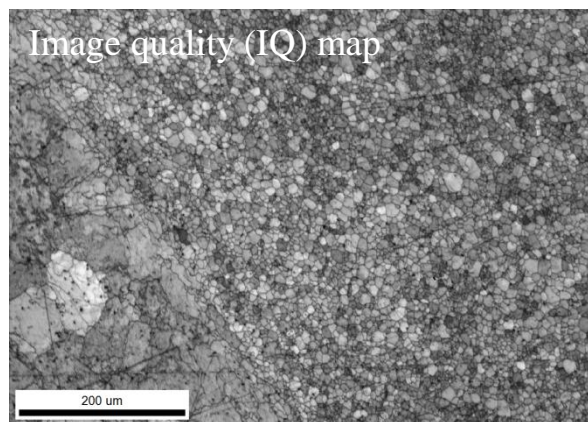


図 アルミニウム合金の摩擦攪拌接合部におけるEBSPによる結晶方位解析の一例

使用装置 : 電界放出形走査電子顕微鏡 (日本電子株式会社 JSM-7001FTTLs)